

สรุปผลการทดลอง ปัญหาและข้อเสนอแนะ

ในงานวิจัยครั้งนี้ได้เตรียมฟิล์มสังกะสีซัลไฟด์โดยวิธีระเหยด้วยความร้อนในระบบสุญญากาศ แล้วนำฟิล์มไปศึกษา I-V characteristic ค่า dielectric constant ความสัมพันธ์ระหว่างความถี่กับค่า dielectric constant และการยอมให้แสงทะลุผ่าน ซึ่งวิธีการเตรียมฟิล์มและผลการศึกษาลักษณะสมบัติของฟิล์มพอสรุปได้ดังนี้

5.1 สรุปผลการเตรียมฟิล์มสังกะสีซัลไฟด์

ฟิล์มสังกะสีซัลไฟด์ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เตรียมขึ้นจากผงสังกะสีซัลไฟด์ 97 % โดยวิธีระเหยด้วยความร้อนในระบบสุญญากาศ ใช้ boat โมลิบดีนัมเป็น heater และใช้กระจกสไลด์เป็นแผ่นรองรับ (substrate) ฟิล์มที่เตรียมขึ้นเป็นแบบ sandwich มีทั้งหมด 5 แผ่น ดังนี้

ฟิล์ม	ความหนา (A)	เตรียมที่ความดัน (mb)	ชั้นไฟฟ้า
A	20-180	1.5×10^{-5}	อลูมิเนียม
B	100-800	2.0×10^{-5}	อลูมิเนียม
C	250-2200	2.0×10^{-5}	อลูมิเนียม
D	10-80	1.4×10^{-5}	ทองคำ
E	300-1500	2.0×10^{-5}	ทองคำ

ตารางที่ 5.1 แสดงสมบัติทั่วไปของฟิล์ม

ฟิล์มที่เตรียมได้แบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ

1. ฟิล์มบางมาก ได้แก่ฟิล์ม A และ D ลักษณะของฟิล์มจะโปร่งใสคล้ายกับไม่มีอะไรมาเกาะสำหรับความหนาแน่น ๆ แต่พอความหนาแน่นมากขึ้นจะเห็นลักษณะเป็นฝ้าขาว สังเกตระดับความหนาด้วยตาเปล่าไม่ได้ ฟิล์มกลุ่มนี้ใช้อัตราการระเหยประมาณ 100 Å - 200 Å ต่อนาที
2. ฟิล์มหนานปานกลาง ได้แก่ฟิล์ม B ถ้านำฟิล์มไปรับแสงจะเห็นสีแยกกันตามความหนาอย่างชัดเจนเมื่อฟิล์มหนาตั้งแต่ 600 Å ขึ้นไป ฟิล์มกลุ่มนี้ใช้อัตราการระเหยประมาณ 200 Å ต่อนาที
3. ฟิล์มหนามาก ได้แก่ฟิล์ม C และฟิล์ม E ลักษณะฟิล์มจะเป็นสีแยกกันตามความหนาอย่างชัดเจนระเหยด้วยอัตรา 200 Å ต่อนาที

ในการวัดความหนาของฟิล์มอาศัยการ เปลี่ยนความถี่ของผลึกควอทซ์โดยใช้ผลึกควอทซ์ที่มีความถี่ resonance 10 MHz ซึ่งความถี่จะเปลี่ยนไป 8.81 Hz ต่อความหนาของฟิล์ม 1 Å จึงแสดงไว้ในภาคผนวก ก.

5.2 สรุปผลการวัดกระแสและความต้านทานของฟิล์ม (I-V characteristic)

เมื่อใส่ความต้านทานศักย์ภายนอกเข้าไปพบว่าจะมีกระแสไหลผ่านฟิล์มมากพอที่จะวัดได้สะดวก (ไม่น้อยกว่า 10^{-10} A) เฉพาะฟิล์มที่มีความหนาไม่เกิน 300 Å ในช่วงความต้านทานศักย์ไม่เกิน 1.5 โวลต์ กระแสที่ไหลผ่านฟิล์มจะไม่ค่อยสัมพันธ์กับความหนาของฟิล์มอย่างมีกฎเกณฑ์ ขนาดของกระแสผ่านฟิล์มจะอยู่ในช่วง 10^{-10} - 10^{-6} Å ยิ่งกว่านั้นฟิล์มบางตัวยังทะลุ (break down) ก่อนที่ความต้านทานศักย์คร่อมฟิล์มจะถึง 1.5 volt จากตารางที่ 4.1 และ 4.6 พบว่า break down voltage ของฟิล์มบางตัวเป็นดังนี้

ฟิล์ม	ความหนา (Å)	break down voltage (volt)
A ₁	20	0.8
A ₃	70	1.1
A ₄	85	1.3
A ₆	125	1.5

ตารางที่ 5.2 แสดง break down voltage ของฟิล์ม

เมื่อสังเกตค่า break down voltage ของฟิล์มจะพบว่าฟิล์มหนาขึ้นจะมี break down voltage สูงขึ้น และฟิล์มที่มีความหนาตั้งแต่ 180 Å ขึ้นไปจะมี break down voltage สูงกว่า 1.5 โวลต์

ถ้าสังเกตดูความสัมพันธ์ระหว่างกระแสและความต่างศักย์คร่อมฟิล์ม ดังในกราฟ รูป 4.1-4.5 พบว่า

1. ในช่วงโวลต์ต่ำ ๆ ($V \leq 100 \text{ mV}$) ความสัมพันธ์ระหว่าง I กับ V เป็นแบบเส้นตรงคือ $I \propto V$
2. ในช่วงโวลต์ปานกลางและโวลต์สูง ($100 \text{ mV} < V \leq 1.5 \text{ volt}$) กระแส I จะแปรตาม V^2

5.3 สรุปผลการวัดความจุของฟิล์มและการวัดค่า dielectric constant ของสังกะสีซัลไฟด์

จากการวัดค่า RC time constant ของระบบฟิล์มและตัวต้านทานที่ทราบค่า แล้วนำมาคำนวณหาความจุของฟิล์มและค่า dielectric constant ของสังกะสีซัลไฟด์ ได้ดังต่อไปนี้

ฟิล์ม	ความหนา (\AA)	ความจุ ($\times 10^{-8}$ Farad)	ϵ_r
A	20-180	0.48-5.3	1.27 ± 0.51
B	100-800	1.85-3.4	6.23 ± 1.31
C	250-2200	0.50-1.8	6.68 ± 0.63

ตารางที่ 5.3 แสดงความจุและค่า ϵ_r ที่หาได้จากฟิล์ม A, B และ C

จากตารางที่ 5.3 พบว่าค่า dielectric constant (ϵ_r) ที่หาได้จากฟิล์มที่มีความหนามากขึ้นจะได้ออกมาสูงขึ้น

5.4 สรุปผล การทะลุผ่านฟิล์มของแสง

เมื่อวิเคราะห์การทะลุผ่านฟิล์มของแสงพบว่าฟิล์ม A มีการทะลุผ่านค่อนข้างสูงและมีค่าเกือบคงที่คือ 87.5-89.2 % ส่วนฟิล์ม B และ C การทะลุผ่านจะเป็นแบบ oscillatory ซึ่งการทะลุผ่านต่ำสุด (minimum transmissivity) เป็น 72.1 % และ 65 % ตรงกับความหนา 700 \AA และ 1450 \AA ส่วนการทะลุผ่านมากที่สุด (maximum transmissivity) เป็น 98.2, 78.8 และ 78.2 % ตรงกับความหนา 300 \AA , 1050 \AA และ 1750 \AA ตามลำดับ

5.5 ปัญหาและข้อเสนอนแนะ

ในการเตรียมและศึกษาสมบัติต่าง ๆ ของฟิล์มสังกะสีซัลไฟด์ในงานวิจัยครั้งนี้ ได้พบปัญหาหลายอย่างที่ทำให้เกิดความยุ่งยากในการเตรียมฟิล์มและอาจกระทบต่อผลการทดลองด้วย ปัญหาเหล่านี้ควรจะได้รับการแก้ไขสำหรับการทดลองในคราวต่อไป

5.5.1 ปัญหาในการเตรียมฟิล์ม

1. เนื่องจากสังกะสีซัลไฟด์ที่นำมาเตรียมฟิล์มมีสภาพเป็นผงมีความหนาแน่นต่ำ เนื้อไม่แน่นพอจึงมีก๊าซแทรกอยู่มาก เมื่อนำมาระเหยด้วยความร้อน ผงสังกะสีซัลไฟด์

จะกระเด็นออกจาก boat หมดจนที่จะกลายเป็นไอ

2. ในการเตรียมฟิล์มสังกะสีขี้เหล็ก และเตรียมขั้วไฟฟ้าสลับกันไป หากมีการถอด heater เข้าออกบ่อย ๆ จะทำให้หักโค้งง่าย

3. ในการเตรียมฟิล์มที่มีความหนามาก ๆ จะต้องใช้เวลานาน heater จะนำความร้อนไปยังเสาขี้เหล็ก ทำให้เสาขี้เหล็ก heater ร้อนอาจทำให้ระบบ seal กันก๊าซรั่วเสียได้

ข้อเสนอแนะ

1. ควรนำผงสังกะสีขี้เหล็กไปอัดให้เป็นเม็ดคล้ายเครื่องอัด hydrolic ที่ความดันประมาณ $3000-5000 \text{ N/m}^2$ เพื่อให้สังกะสีขี้เหล็กมีความหนาแน่นมากขึ้นกระเด็นออกจาก boat ใดยาก และยังเป็นการใช้การไล่อากาศที่แทรกอยู่ออกไปบางส่วนด้วย หรืออาจจะเปลี่ยนไปใช้สังกะสีขี้เหล็กที่เป็นผลึกก็ได้ นอกจากนี้อาจใช้ผงสังกะสีขี้เหล็กผสมกับน้ำมันเป็นแท่ง สอดไว้ใน heater ทั้งสะเทิน ซึ่งขดเป็นเกลียว เมื่อค่อย ๆ ให้ความร้อนจนสังกะสีขี้เหล็กหลอมเป็น sinter⁽⁵⁾ เกาะอยู่กับ heater โดยไม่มีการกระเด็นออก

2. ควรสร้างที่ยึด heater 2 ชุด ใช้ระบบสายที่ละเอียดสลับกันโดยใช้สวิตซ์เลือก ไม่ทองแดง heater เข้าออกบ่อย ขณะที่เตรียมสารชนิดหนึ่ง ก็ใช้อลูมิเนียมหล่อขี้เหล็ก heater อีกอันไว้เพื่อหลีกเลี่ยงสารไปปนกัน

3. ควรใช้ heater หรือ boat ที่เป็นแผ่นบาง ๆ ซึ่งจะให้อุณหภูมิสูงแต่จะเก็บสะสมความร้อนไว้ได้น้อย ดังนั้นการถ่ายเทความร้อนไปยังเสาขี้เหล็ก heater จึงมีน้อย

5.5.2 ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความหนาของฟิล์ม

1. ในการวัดความหนาของฟิล์ม ปรากฏการอ่านความถี่ของผลึกควอทซ์จากเครื่องนับความถี่ไม่ค่อยสะดวก คือเมื่อความถี่ที่แสดงบนหน้าปัดเข็มโตคาที่ทำการตามที่ต้องการแล้ว ในหลอดทดลองกับความหนาไว้แล้ว จะต้องเสียเวลาในการเลื่อนขั้วเตอร์ไปตำแหน่งใหม่ ซึ่งขณะที่กำลังเลื่อนขั้วเตอร์ ความถี่ของผลึกควอทซ์ก็จะเปลี่ยนไปเป็นค่าใหม่ ทำให้ค่าที่อ่านได้คลาดเคลื่อน

2. ในขณะที่สารสังกะสีซัลไฟด์เริ่มกลายเป็นไอ ความดันในครอบแก้วสูญญากาศจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ซึ่งจะทำให้ความถี่ของผลึกควอทซ์เปลี่ยนไปโดยที่ไม่มีสารมาเกาะ ทั้งนี้เนื่องจากความถี่ของผลึกควอทซ์ขึ้นกับความดันคว่ำคังแสดงในภาคผนวก ค ซึ่งจะทำให้ความถี่ที่อ่านได้ขณะเตรียมฟิล์มคลาดเคลื่อนได้

ข้อเสนอแนะ

1. ควรมีการปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์เตอร์โดยใช้ **stepping motor** ซึ่งควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะทำให้สามารถกำหนดระยะเลื่อนขั้วเตอร์ได้สะดวก และแม่นยำยิ่งขึ้น

2. หลังจากสังกะสีซัลไฟด์เริ่มกลายเป็นไอ ควรรอสักระยะหนึ่งก่อนเปิดขั้วเตอร์ เพื่อให้ความดันในครอบแก้วลดลงไปอยู่ที่เดิมหรือใกล้เคียง แล้วความดันจะมีค่าเกือบคงที่ถ้าอัตราการระเหยของสารไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก

5.5.3 ปัญหาในการหาความจุของฟิล์ม

ในการหาค่าความจุของฟิล์มจะต้องนำฟิล์มไปต่ออนุกรมกับตัวต้านทานที่ทราบค่าแล้วป้อนสัญญาณรูปสี่เหลี่ยมเข้าไปวัดเวลาที่ความต่างศักย์คร่อมฟิล์มลดลงจนเหลือ 37 % ของค่าสูงสุดซึ่งเรียกว่า **RC time constant** ในการวัด **RC time constant** นี้จะมีปัญหาหลายประการได้แก่

1. ถ้าเลือกตัวต้านทานค่าที่ไม่พอเหมาะจะทำให้ไคร์กราฟแสดงความทางศักย์คร่อมฟิล์มบนจอของซิลโลสโคปกว้างหรือแคบเกินไปจะอ่านค่าไม่สะดวก ยิ่งกว่านั้นยังอาจพบเส้นกราฟที่ไม่เป็นแบบ **exponential** อย่างสมบูรณ์ ทำให้การอ่านค่าผิดพลาดได้

2. เกี่ยวกับความถี่ของแหล่งกำเนิดสัญญาณ ถ้าใช้ความถี่สูงเกินไป จะทำให้ตัวเก็บประจุ (ฟิล์ม) ได้รับความถี่ประจุยังไม่เต็มหรือคายประจุออกไม่หมดก็จะมีสัญญาณดูใหม่เข้ามา ดังนั้นความทางศักย์คร่อมฟิล์มที่วัดได้จึงไม่ใช่ 37 % ของค่าสูงสุดอย่างแท้จริง

3. เนื่องจากการอ่านค่าความทางศักย์คร่อมฟิล์มและค่า **RC time constant** ของระบบ จะต้องอ่านจากสเกลของซิลโลสโคปซึ่งแบ่งไว้อย่างหยาบ ๆ การประมาณด้วยสายตาจึงอาจคลาดเคลื่อนไคร้มาก

ข้อเสนอแนะ

1. ทดลองเลือกตัวต้านทานหลาย ๆ ค่าใส่ดูก่อน แล้วสังเกตเส้นกราฟบนจอของซิลโลสโคปจะเปลี่ยนไปจนเข้าไคร์กราฟ **exponential** ที่สมบูรณ์และมีช่องที่อ่านค่า **time constant** ไม่เล็กจนเกินไป โดยอาจปรับ **time base** ของซิลโลสโคปช่วยด้วยก็ได้

2. การที่จะทำให้ตัวเก็บประจุถูกอัดประจุจนเต็มหรือคายประจุออกจนหมด จะต้องใช้เวลานานมากเป็นอนันต์ ซึ่งเราไม่สามารถรอนันต์จนได้ ดังนั้นเราจึงควรกำหนดเวลาที่ปล่อยให้ตัวเก็บประจุถูกอัดประจุหรือคายประจุจนพอสมควรคือมากกว่า 100 เท่าของค่า **RC time constant** อย่างไรก็ดีโดยอุณหคณิตแล้วความถี่ต่ำสุดหรือความถี่ DC น่าจะดีที่สุดสำหรับการวัด **RC time constant** แต่ในทางปฏิบัติแล้ว ในช่วงความถี่ต่ำมาก ๆ ซิลโลสโคปจะทำงานไม่ได้ดี ดังนั้นจึงควรเลือกความถี่ของสัญญาณให้พอเหมาะ

3. ควรใช้ซิลโลสโคปที่มีตัวเลขบอกโวลต์และค่าเวลาของสัญญาณที่ถ้าสังวัตจึงจะอ่านไคร์ถูกต้อง